**Шелковников, Евгений Юрьевич. Исследование метрологических характеристик сканирующего туннельного микроскопа для изучения кластерных материалов : диссертация ... кандидата технических наук : 05.11.13.- Ижевск, 2000.- 177 с.: ил. РГБ ОД, 61 01-5/1887-3**